

第16回 TEM ユーザーズミーティング

プログラム

09: 30	受付
10: 00～10: 10	開会挨拶
10: 10～10: 30	新型 FIB-SEM JIB-PS500iの紹介 ～JEOLが提供する TEM試料作製ソリューション～ 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 門井 美純
10: 30～10: 50	統合ソフトウェア FEMTUS™の紹介 日本電子株式会社 EM事業ユニット EMアプリケーション部 島 政英
10: 50～11: 30	嗅覚系脳神経回路の三次元デジタル構造解析 ～Correlated Laser and Volume EM Study～ 川崎医科大学 樋田 一徳 様
11: 30～11: 50	IDES製品を用いた、最新の観察と分析手法の紹介 日本電子株式会社 EM事業ユニット EMアプリケーション部 橋口 裕樹
11: 50～12: 20	昼食
12: 20～13: 30	実機・ポスター展示
13: 30～14: 10	EDMを利用した TEM内熱輸送計測法の紹介 国立研究開発法人物質・材料研究機構 川本 直幸 様
14: 10～14: 50	液体セル透過型電子顕微鏡その場観察の現状と課題 ～これまでに何が見えていて、次に何を見にいくか～ 北海道大学低温科学研究所 木村 勇氣 様
14: 50～15: 30	休憩 / 実機・ポスター展示
15: 30～15: 50	マシンビジョンによる In-Situ観察 TEMワークフロー・ソリューション Protochips Joe Sanguedolce
15: 50～16: 40	JEOLと私 国立大学法人東北大学 / 日本電子株式会社 田中 通義 様
16: 40～16: 50	閉会挨拶
16: 50～18: 00	懇親会 / 実機・ポスター展示

* プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。